

1. Record Nr.	UNINA9910555082603321
Autore	Dahoo Pierre Richard
Titolo	Applications and metrology at nanometer scale 1 : smart materials, electromagnetic waves and uncertainties / / Pierre-Richard Dahoo, Philippe Pougnet, Abdelkhalak El Hami
Pubbl/distr/stampa	Hoboken, New Jersey : , : John Wiley & Sons, Incorporated London, England : , : ISTE Ltd, , [2021] ©2021
ISBN	1-119-80814-6 1-119-80824-3 1-119-80822-7
Descrizione fisica	1 online resource (251 pages) : illustrations
Disciplina	780
Soggetti	Materials Electronic books.
Lingua di pubblicazione	Inglese
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia
Nota di bibliografia	Includes bibliographical references and index.